

产品介绍

HDRZ-I变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量，该变压器绕组变形测试仪采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法，能对变压器内部故障作出准确判断。它适用于63kV~500kV电力变压器的内部结构故障检测。

产品特点

- 变压器绕组变形测试仪采集控制采用高速、高集成化微处理器，对同一相重复试验，测量重复率在99.5%以上
- 硬件机芯采用DDS专用数字高速扫频技术(美国)，通过测试可以准确诊断出绕组发生扭曲、鼓包、移位、倾斜、匝间短路变形及相间接触短路等故障
- 本公司生产的变压器绕组变形测试仪具有线性扫频测量和分段扫频测量双测量系统功能，兼容当前国内两种技术流派的测量模式
- 幅频特性符合国家关于幅频特性测试仪的技术指标。横坐标(频率)具有线性分度及对数分度两种。

技术参数

幅度测量范围	(-100dB)~(+20dB)
幅度测量精度	±1dB
扫描频率精度	0.01%
信号输入阻抗	1MΩ
信号输出阻抗	50Ω
同相测试重复率	99.5%
测量仪器尺寸	300×340×120mm ³
总体重量	10kg

产品细节

